

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 4 月 19 日 (2007.4.19)

【公開番号】特開 2004-279419 (P2004-279419A)
 【公開日】平成 16 年 10 月 7 日 (2004.10.7)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-039
 【出願番号】特願 2004-68357 (P2004-68357)
 【国際特許分類】

G 0 1 T 1/20 (2006.01)

H 0 1 L 31/09 (2006.01)

【F I】

G 0 1 T 1/20 G

G 0 1 T 1/20 C

G 0 1 T 1/20 D

H 0 1 L 31/00 A

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 3 月 6 日 (2007.3.6)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 5
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【0 0 0 5】

C T 検出器の検出器セル同士の間での「クロストーク (cross talk)」はよくあることである。「クロストーク」とは一般に、C T 検出器の隣接するセル間でのデータのやり取りと規定されている。一般に、クロストークは再構成された最終の C T 画像内にアーチファクトを存在させることにつながり、かつ空間分解能の悪化に寄与するため、クロストークを低下させることが求められる。典型的には、単一の C T 検出器内には 4 種類のクロストークが発生する可能性がある。X 線散乱によってシンチレータ・セル間において X 線クロストークが生じることがある。シンチレータを囲繞している反射体を光が通過することによって光学的クロストークが生じることがある。周知の C T 検出器はエポキシが典型的であるような接触式光学結合層 (複数層のこともある) を利用し、シンチレータ・アレイをフォトダイオード・アレイに固定させている。しかし、あるセルからの光がこの接触層を通過して別のセルに伝わるとクロストークが生じる可能性がある。フォトダイオード間での望ましくないやり取りによって電氣的クロストークが生じる可能性がある。上述した種類のクロストークのうち、接触式光学カプラ層 (複数層のこともある) を通じたクロストークが、C T 検出器内のクロストークの主たる発生源と考えられるのが一般的である。

【特許文献 1】米国特許第 6 3 9 3 0 9 2 号